

Microdiffraction Laue : de la mesure à l'analyse des données



Formation CNRS-ANF

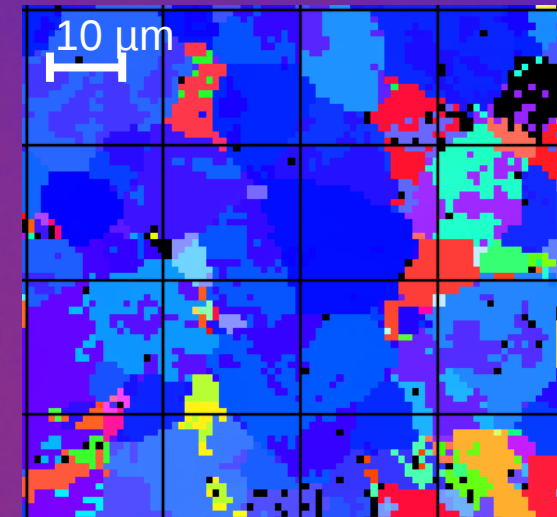
Polygone Scientifique, Grenoble, 26-29 septembre 2017

Applications de la Microscopie X Laue

- Cartographies/Imagerie de la microstructure:
phase, orientation, déformation/contrainte, position/forme des grains,
localisation/nature des défauts cristallins...
- *Polycrystal, monocristal, objet unique, métal, isolant, couche mince...*
- *In situ & operando : température, mécanique, électrique...*

Programme :

- Cours théoriques
- Travaux pratiques sur la ligne de lumière synchrotron à l'ESRF
- Travaux dirigés de traitement de données (suite logicielle LaueTools)



Contacts: J.-S. Micha
Ligne CRG-IF BM32 à l'ESRF
micha@esrf.fr

